

「半導体集積回路 信頼性認定ガイドラインセミナー」 ～AEC-Q100を超える日本発、車載・一般用途半導体部品 認定ガイドラインの紹介～ 〈品質・信頼性を確保する新しい信頼性認定規格の世界標準化動向〉 (第2版:ファミリの考え方を追加)

- 主 催：半導体信頼性技術小委員会
- 担当部署：電子デバイス部
- 参加者数：約42名

概 要

新興国の半導体の品質、信頼性レベルが不明確である、また、車載用を含めた半導体部品の品質認定方法が分からない等の問題に対して、JEITAでは2011年4月に技術レポートとして「EDR-4708/半導体集積回路信頼性認定ガイドライン」を発行しました。

現在、車載用半導体集積回路の認定規格としてはAEC-Q100が良く知られていますが、AEC-Q100は摩耗故障に注目した過度な強度・寿命を追求する規格になっており、本質的な品質に関する観点が抜けている問題があります。EDR-4708は、半導体部品ユーザが製品に求める「高品質・高信頼性で安心できる製品供給」を少ない試験コスト、短い試験期間、既存試験デー

タの有効活用、で実現するためのガイドラインとして策定いたしました。また本規格は、現在、国際標準化(IEC化)を進めております。その内容、及び今後の展開動向について、セミナーを開催致しました。

今回で3回目の開催となりましたが、アンケート結果を見ると運用面、内容面共に満足度が高まっており、次回セミナーへの期待が増していることが伺えました。次回はこの規格を「どう利用するのか」を説明するために、AEC-Q100も詳細に説明する予定です。次回も内容の濃いセミナーとなりますので、どうぞご期待ください。



プログラム

○開催の挨拶

半導体信頼性技術小委員会 主査 瀬戸屋 孝 氏 (株)東芝

○基調講演

『トヨタ自動車(株)として本ガイドラインへの期待 (仮)』

野瀬 昇 氏 (トヨタ自動車(株))

○質疑応答

○本ガイドラインの概要紹介

『世界標準化への取り組み』

認定WG 主査 伊賀 洋一 氏 (ルネサスエレクトロニクス(株))

○本ガイドラインの詳細紹介

『品質グレードと用途～摩耗故障』

認定WG委員 千葉 健一 氏 (セイコーエプソン(株))

『信頼性試験～解説』 + 第2版、ファミリー取扱い項追加紹介

認定WG委員 安西 靖仁 氏 (ラピスセミコンダクタ(株))

○質疑応答

○閉会の挨拶

半導体信頼性技術小委員会 副主査 田中 政樹 氏 (ルネサスエレクトロニクス(株))